**Вълков, Ивелин Цветанов. Аппаратура и методы электронно-зондового тестирования интегральных микросхем в режиме вторичной электронной эмиссии : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.27.01 / С.-Петербург. гос. электротехн. ун-т.- Санкт-Петербург, 1994.- 16 с.: ил. РГБ ОД, 9 94-1/2143-1**